

CEI 60749-8
(Première édition – 2002)

**Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

Partie 8: Etanchéité

IEC 60749-8
(First edition – 2002)

**Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –**

Part 8: Sealing

CORRIGENDUM 1

Page 28

9.4 Critères de défaillance

Première phrase

Au lieu de:

Un dispositif doit être rejeté s'il gagne 1,0 mg au moins et s'il a un volume interne $\geq 0,01 \text{ cm}^3$ et 2,0 mg au moins si le volume est $> 0,01 \text{ cm}^3$.

lire:

Un dispositif doit être rejeté s'il gagne 1,0 mg au moins et s'il a un volume interne $\leq 0,01 \text{ cm}^3$ et 2,0 mg au moins si le volume est $> 0,01 \text{ cm}^3$.

**CE CORRIGENDUM EST AUSSI
VALABLE POUR:**

CEI 60749
Dispositifs à semiconducteurs –
Essais mécaniques et climatiques
Amendement 2 (2001), page 60 et
Edition 2.2 (2002), page 132, sous
5.7.4 Critères de défaillance

Page 29

9.4 Failure criteria

First sentence

Instead of:

A device shall be rejected if it gains 1,0 mg or more and has an internal volume of $\geq 0,01 \text{ cm}^3$ and 2,0 mg or more if the volume is $> 0,01 \text{ cm}^3$.

read:

A device shall be rejected if it gains 1,0 mg or more and has an internal volume of $\leq 0,01 \text{ cm}^3$ and 2,0 mg or more if the volume is $> 0,01 \text{ cm}^3$.

**THIS CORRIGENDUM IS ALSO VALID
FOR:**

IEC 60749
Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods
Amendment 2 (2001), page 61 and
Edition 2.2 (2002), page 133, under
5.7.4 Failure criteria